

**ANGEWANDTE OBERFLACHENANALYSE MIT SIMS SEKUNDR  
IONEN MASSENSPEKTROMETRIE AES AUGER ELEKTRONEN  
SPEKTROMETRIE XPS RNTGEN PHOTOELEKTRONEN  
SPEKTROMETRIE%0A**

**ANGEWANDTE OBERFLÄCHENANALYSE MIT SIMS SEKUNDÄR  
IONEN MASSENSPEKTROMETRIE AES AUGER ELEKTRONEN  
SPEKTROMETRIE XPS RNTGEN PHOTOELEKTRONEN  
SPEKTROMETRIE%0A**